

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие . . . . .	3
Введение . . . . .	5
<b>Глава 1. Основы теории спектральных приборов . . . . .</b>	<b>10</b>
§ 1. Физические предпосылки построения спектральных приборов . . . . .	—
§ 2. Принципиальная схема щелевого спектрального прибора . . . . .	27
§ 3. Основные характеристики щелевого спектрального прибора . . . . .	32
§ 4. Аппаратная функция . . . . .	40
§ 5. Передача излучения спектральным прибором . . . . .	50
<b>Глава 2. Основные характеристики диспергирующих элементов щелевых спектральных приборов . . . . .</b>	<b>57</b>
§ 6. Призмённые системы . . . . .	—
§ 7. Спектральные дифракционные решетки . . . . .	64
§ 8. Интерферометр Фабри—Перо как диспергирующий элемент . . . . .	71
§ 9. Комбинация диспергирующих элементов . . . . .	75
§ 10. Вогнутые дифракционные решетки . . . . .	80
§ 11. Решетки нового типа . . . . .	85
§ 12. Выбор диспергирующей системы . . . . .	88
<b>Глава 3. Приборы и техника эмиссионной спектроскопии . . . . .</b>	<b>92</b>
§ 13. Основы методов эмиссионного количественного спектрального анализа . . . . .	—
§ 14. Поступление вещества в разряд . . . . .	103
§ 15. Спектрографы . . . . .	107
§ 16. Приборы с фотоэлектрической регистрацией спектра . . . . .	119
§ 17. Источники возбуждения спектров для эмиссионного спектрального анализа . . . . .	129
<b>Глава 4. Практические работы на приборах с фотографической регистрацией спектра . . . . .</b>	<b>141</b>
§ 18. Градуировка спектрографа и измерение длин волн спектра . . . . .	—
§ 19. Измерение линейной дисперсии и реальной разрешающей способности спектрографа . . . . .	146
§ 20. Измерение относительных интенсивностей спектральных линий . . . . .	153
§ 21. Количественный спектральный анализ стали на спектрографе ИСП-30 . . . . .	164
<b>Глава 5. Практические работы по исследованию и настройке приборов . . . . .</b>	<b>173</b>
§ 22. Юстировка и фокусировка призмённого спектрографа . . . . .	—
§ 23. Юстировка установки с плоской дифракционной решеткой . . . . .	179
§ 24. Юстировка и определение характеристик интерферометра Фабри—Перо . . . . .	183
§ 25. Контроль качества решеток и их копий . . . . .	192

Глава 6. Практические работы на приборах с фотоэлектрической регистрацией . . . . .	200
§ 26. Исследование квантометра МФС-4 . . . . .	—
§ 27. Количественный спектральный анализ на квантометре МФС-6, оснащённом микро-ЭВМ 15 ВСМ-5. . . . .	209
§ 28. Количественный спектральный анализ на стилометре ФЭС-1 . . . . .	222
§ 29. Исследование автоматического спектрометра ФСЛ с последовательным определением состава пробы . . . . .	227
Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 . . . . .	234
Список литературы . . . . .	243